(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-155118 (P2002-155118A)

(43)公開日 平成14年5月28日(2002.5.28)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参 考)
C08F 220/22		C08F 220/22	2H025
220/16		220/16	4 J 1 0 0
G03F 7/004	5 0 1	G03F 7/004	5 0 1
7/039	6 0 1	7/039	6 0 1
H01L 21/027		H 0 1 L 21/30	5 0 2 R
		審查請求未請求	請求項の数11 OL (全 22 頁)
(21)出願番号	特願2001-266869(P2001-266869)	(71)出願人 00000206 倉越化学	0 ↑業株式会社

(22)出願日 平成13年9月4日(2001.9.4)

(31)優先権主張番号 特願2000-271205(P2000-271205) (32)優先日 平成12年9月7日(2000,9,7)

(33)優先権主張国 日本(JP)

信越化学工業株式会社

東京都千代田区大手町二丁目6番1号

(71)出願人 000005821

松下電器產業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(71)出顧人 000002200

セントラル硝子株式会社

山口県宇部市大字沖宇部5253番地

(74)代理人 100079304

弁理士 小島 隆司 (外1名)

最終頁に続く

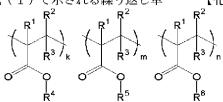
(54) 【発明の名称】 高分子化合物、レジスト材料及びパターン形成方法

(57)【要約】

【解決手段】 下記一般式(1)で示される繰り返し単

位を有する高分子化合物。

【化1】



ある。)

(式中、 $R^1 \sim R^3$ は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 $1 \sim 20$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、各単位中の $R^1 \sim R^3$ は互いに同一でも異なっていてもよい。 R^4 は少なくとも一つ以上のフッ素原子を含む、炭素数 $1 \sim 20$ のフッ素化された 1 価炭化水素基である。 R^5 、 R^6 はそれぞれ酸不安定基、密着性基であり、 $0 < k+m+n \le 1$ で

【効果】 本発明のレジスト材料は、高エネルギー線に 感応し、200nm以下、特に170nm以下の波長に おける感度が優れているうえに、エステル側鎖へのフッ 素の導入により透明性が著しく向上し、それと同時に優 れた解像性を有する。

(1)

【特許請求の範囲】

下記一般式(1)で示される繰り返し単* 【請求項1】

1

(式中、R¹~R³は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 はフッ素化されたアルキル基であり、各単位中のR1~ R3は互いに同一でも異なっていてもよい。R4は少なく とも一つ以上のフッ素原子を含む、炭素数1~20のフ ッ素化された1価炭化水素基である。R5、R6はそれぞ れ酸不安定基、密着性基であり、0<k+m+n≤1で ある。)

【請求項2】 上記一般式(1)において、R4~R6を 含む単位のうち少なくとも一つが脂環式構造を有するこ とを特徴とする請求項1記載の高分子化合物。

【請求項3】 上記一般式(1)において、R5が少な くとも一つの脂環式構造を有することを特徴とする請求 項2記載の高分子化合物。

【請求項4】 上記一般式(1)において、 R^1 がメチ ル基又はトリフルオロメチル基であることを特徴とする 請求項1、2又は3記載の高分子化合物。

【請求項5】 上記一般式(1)において、R4中のフ ッ素原子数が3~9個であることを特徴とする請求項1 乃至4のいずれか1項記載の高分子化合物。

【請求項6】 請求項1乃至5のいずれか1項記載の高 分子化合物を含むことを特徴とするレジスト材料。

【請求項7】 (A)請求項1乃至5のいずれか1項記 載の高分子化合物、(B)有機溶剤、(C)酸発生剤を 含有することを特徴とする化学増幅ポジ型レジスト材 料。

【請求項8】 更に塩基性化合物を含有する請求項7記 載のレジスト材料。

【請求項9】 更に溶解阻止剤を含有する請求項7又は 8記載のレジスト材料。

【請求項10】 (1)請求項6乃至9のいずれか1項 に記載のレジスト材料を基板上に塗布する工程と、

(2)次いで加熱処理後、フォトマスクを介して波長1 10~180nm帯又は1~30nm帯の高エネルギー 線で露光する工程と、(3)必要に応じて加熱処理した 後、現像液を用いて現像する工程とを含むことを特徴と するパターン形成方法。

【請求項11】 前記高エネルギー線がF2エキシマレ ーザー、Ar2エキシマレーザー、又は軟X線であるこ とを特徴とする請求項10記載のパターン形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

* 位を有する高分子化合物。

【化1】

※【発明の属する技術分野】本発明は、レジスト材料、特 1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又 10 に微細加工技術に適した化学増幅レジスト材料のベース ポリマーとして有用な高分子化合物並びにこれを含むレ ジスト材料及びこれを用いたパターン形成方法に関す

(1)

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】近年、 LSIの高集積化と高速度化に伴い、パターンルールの 微細化が求められている。微細化が急速に進歩した背景 には投影レンズの高NA化、レジストの性能向上、短波 長化が挙げられる。レジストの高解像度化及び高感度化 に関しては、光照射によって発生する酸を触媒とした化 学増幅ポジ型レジスト材料は優れた性能を有するもので あり、遠紫外線リソグラフィーにおいて特に主流なレジ スト材料になった(特公平2-27660号、特開昭6 3-27829号公報等に記載)。また、i線(365 nm)からKrF(248nm)への短波長化は大きな 変革をもたらし、KrFエキシマレーザー用レジスト材 料は0.30ミクロンプロセスに始まり、0.25ミク ロンルールを経て、現在0.18ミクロンルールの量産 化への適用へと展開している。更には、0.15ミクロ ンルールの検討も始まっており、微細化の勢いはますま す加速されている。

【0003】ArF(193nm)では、デザインルー ルの微細化を 0.13μm以下にすることが期待されて いるが、ノボラックやポリビニルフェノール系などの従 来用いられていた樹脂が193nm付近に非常に強い吸 収を持つため、レジスト用のベース樹脂として用いるこ とができない。そこで透明性と必要なドライエッチング 耐性の確保のため、アクリル系樹脂やシクロオレフィン 系などの脂環族系の樹脂が検討された(特開平9-73 173号、特開平10-10739号、特開平9-23 0595号公報、WO97/33198)。

【0004】 F_2 (157nm) に関しては0.10 μ m以下の微細化が期待されているが、透明性の確保がま すます困難になり、ArF用ベースポリマーであるアク リル樹脂では全く光を透過せず、シクロオレフィン系に おいてもカルボニル結合を有するものは強い吸収を持つ ことがわかった。また、KェF用ベースポリマーのポリ ビニルフェノールについては、160mm付近に吸収の ウィンドウがあり、若干透過率が向上するものの、実用 ※50 的なレベルにはほど遠いことが判明した。

【0005】本発明は上記事情に鑑みなされたものであり、300nm以下、特にF2(157nm)、Kr2(146nm)、KrAr(134nm)、Ar2(126nm)などの真空紫外光における透過率に優れた化学増幅レジスト材料のベースポリマーとして有用な新規高分子化合物並びにこれを含むレジスト材料及びこれを用いたパターン形成方法を提供することを目的にする。

[0006]

【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】本 発明者は上記目的を達成するため鋭意検討を重ねた結 *10

(式中、 $R^1 \sim R^3$ は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 $1 \sim 20$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、各単位中の $R^1 \sim R^3$ は互いに同一でも異なっていてもよい。 R^4 は少なくとも一つ以上のフッ素原子を含む、炭素数 $1 \sim 20$ のフッ素化された 1 価炭化水素基である。 R^5 、 R^6 はそれぞれ酸不安定基、密着性基であり、 $0 < k+m+n \le 1$ である。)

請求項2:上記一般式(1)において、R⁴~R⁶を含む 単位のうち少なくとも一つが脂環式構造を有することを 特徴とする請求項1記載の高分子化合物。

請求項3:上記一般式(1)において、R⁵が少なくとも一つの脂環式構造を有することを特徴とする請求項2記載の高分子化合物。

請求項4:上記一般式(1)において、R¹がメチル基 又はトリフルオロメチル基であることを特徴とする請求 項1、2又は3記載の高分子化合物。

請求項5:上記一般式(1)において、R4中のフッ素 原子数が3~9個であることを特徴とする請求項1乃至 4のいずれか1項記載の高分子化合物。

請求項6:請求項1乃至5のいずれか1項記載の高分子 化合物を含むことを特徴とするレジスト材料。

請求項7:(A)請求項1乃至5のいずれか1項記載の 高分子化合物、(B)有機溶剤、(C)酸発生剤を含有 40 することを特徴とする化学増幅ポジ型レジスト材料。

請求項8: 更に塩基性化合物を含有する請求項7記載の レジスト材料。

請求項9:更に溶解阻止剤を含有する請求項7又は8記載のレジスト材料。

請求項10:(1)請求項6乃至9のいずれか1項に記※

*果、エステル側鎖中にフッ素化アルキル基を含むアクリル酸エステル樹脂をベースポリマーとして用いることにより、高い透明性を確保したレジスト材料が得られること知見し、本発明に至ったものである。

【0007】即ち、本発明は下記の高分子化合物、化学 増幅レジスト材料及びパターン形成方法を提供する。 請求項1:下記一般式(1)で示される繰り返し単位を 有する高分子化合物。

【化2】

※載のレジスト材料を基板上に塗布する工程と、(2)次いで加熱処理後、フォトマスクを介して波長110~180nm帯又は1~30nm帯の高エネルギー線で露光20する工程と、(3)必要に応じて加熱処理した後、現像液を用いて現像する工程とを含むことを特徴とするパターン形成方法。

(1)

請求項11: 前記高エネルギー線が F_2 エキシマレーザー、 Ar_2 エキシマレーザー、又は軟X線であることを特徴とする請求項10記載のパターン形成方法。

【0008】即ち、157nm付近の透過率を向上させ る方法としては、カルボニル基や炭素-炭素間二重結合 の数の低減化も一つの方法と考えられるが、ベースポリ マー中へのフッ素原子の導入も透過率向上に大きく寄与 することがわかってきた。実際、ポリビニルフェノール の芳香環にフッ素を導入したポリマーは実用的に近い透 過率を得ることができた。しかしながら、このベースポ リマーはF2レーザーのような高エネルギー光の照射に よりネガ化が進行することが顕著になり、レジストとし ての実用化は難しいことが判明した。これに対し、アク リル系樹脂やノルボルネン誘導体由来の脂肪族環状化合 物を主鎖に含有する高分子化合物にフッ素を導入したポ リマーは、吸収が低く抑えられるうえにネガ化の問題も 解決できることがわかった。特に、本発明のように、エ ステル側鎖にフッ素を導入すると、157nm付近での 透過率が著しく向上することが判明したものである。

【0009】以下、本発明について更に詳しく説明する。本発明にかかわる高分子化合物は、下記一般式 (1)で示される繰り返し構造を有するものである。

[0010]

【化3】

4

(式中、 $R^1 \sim R^3$ は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 $1 \sim 20$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、各単位中の $R^1 \sim R^3$ は互いに同一でも異なっていてもよい。 R^4 は少なくとも一つ以上のフッ素原子を含む、炭素数 $1 \sim 20$ のフッ素化された 1 価炭化水素基である。 R^5 、 R^6 はそれぞれ酸不安定基、密着性基であり、 $0 < k+m+n \le 1$ である。)

【0011】R¹~R³において、炭素数1~20の直鎖 状、分岐状もしくは環状のアルキル基としては、メチル 基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nープロ ピル基、secーブチル基、tertーブチル基、シク ロペンチル基、シクロヘキシル基、2-エチルヘキシル 基、n-オクチル基などが例示でき、特に炭素数1~1 2、とりわけ炭素数1~10のものが好ましい。フッ素 化されたアルキル基としては、上記アルキル基の水素原 子の一部又は全部がフッ素原子で置換されたものであ -CH₂CF₃ -CH₂CF₂CF₃

*り、例えばトリフルオロメチル基、2,2,2ートリフルオロエチル基、3,3,3ートリフルオロプロピル基、1,1,2,2,3,3,3ーヘプタフルオロプロ ピル基などが挙げられる。この場合、R¹としては、特にメチル基又はトリフルオロメチル基であることが好ましい。

【0012】式(1)において、R4は、炭素数1~2 0のフッ素置換1価炭化水素基であり、直鎖状、分岐状 もしくは環状のアルキル基(このアルキル基としては上 記と同様のものが例示される)、フェニル基、トリル 基、キシリル基、ナフチル基等のアリール基、ベンジル 基、フェニルエチル基、フェニルプロピル基等のアラル キル基などの非置換の1価炭化水素基の水素原子の一部 又は全部をフッ素原子で置換した基が挙げられ、具体的 には下記のものを例示できる。

[0013]

【化4】 — $\mathsf{CH_2}(\mathsf{CF_2})_2\mathsf{H}$ — $\mathsf{CH_2}(\mathsf{CF_2})_2\mathsf{CF_3}$

—CH₂(CF₂)₃H —CH₂(CF₂)₄H —CH₂(CF₂)₆H

 $--\mathsf{CH}_2(\mathsf{CF}_2)_3\mathsf{CF}_3 \qquad --\mathsf{CH}_2(\mathsf{CF}_2)_6\mathsf{CF}_3 \qquad --\mathsf{CH}_2\mathsf{CH}_2(\mathsf{CF}_2)_7\mathsf{CF}_3$

 $-CH_2(CF_2)_{10}H$

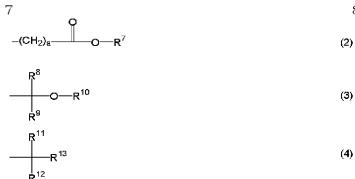
特に、 R^4 としては、 R^4 中のフッ素原子数が $3\sim9$ 個のものが好ましい。

【0014】次に、式(1)における酸不安定基について説明する。酸不安定基については種々選定されるが、※

※特に下記式 (2) ~ (4) で示される基等であることが 好ましい。

【0015】

【化5】



(式中、R7、R10は炭素数1~20の直鎖状、分岐状 もしくは環状のアルキル基等の1価炭化水素基であり、 R8、R9は水素原子、又は炭素数1~20の直鎖状、分 岐状もしくは環状のアルキル基である。R11~R13は、 炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキ ル基等の1価炭化水素基であり、一部の水素原子がフッ 素原子で置換されていてもよい。R7~R13は、酸素、 硫黄、窒素、フッ素などのヘテロ原子を含んでもよい。 R⁸ & R⁹ \ R⁸ & R¹⁰ \ R⁹ & R¹⁰ \ R¹¹ & R¹¹ & R¹¹ & R¹³、R¹²とR¹³はそれぞれ結合して環を形成してもよ 20 い。aは0~10の整数である。)

【0016】より好ましくは、以下の通りである。式 (2) において、R7は炭素数4~20、好ましくは4 ~15の三級アルキル基を示し、式(2)の具体例とし ては、tert-ブトキシカルボニル基、tert-ブ トキシカルボニルメチル基、tert-アミロキシカル ボニル基、tert-アミロキシカルボニルメチル基、 1,1-ジエチルプロピルオキシカルボニル基、1,1 ージエチルプロピルオキシカルボニルメチル基、1-エ チルシクロペンチルオキシカルボニル基、1-エチルシ 30 に下記の基が例示できる。このうち、エトキシエチル クロペンチルオキシカルボニルメチル基、1-エチルー 2-シクロペンテニルオキシカルボニル基、1-エチル -2-シクロペンテニルオキシカルボニルメチル基、1 -エトキシエトキシカルボニルメチル基、2-テトラヒ ドロピラニルオキシカルボニルメチル基、2-テトラヒ*

*ドロフラニルオキシカルボニルメチル基等が例示でき る。

【0017】式(3)において、R8、R9は水素原子又 は炭素数1~18、好ましくは1~10の直鎖状、分岐 状もしくは環状のアルキル基を示し、具体的にはメチル 基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nー ブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、シ クロペンチル基、シクロヘキシル基、2-エチルシクロ ヘキシル基、n-オクチル基等を例示できる。R10は炭 素数1~20、好ましくは1~10の酸素原子などのへ テロ原子を含んでもよい1価炭化水素基を示し、直鎖 状、分岐状、環状のアルキル基、これらの水素原子の一 部が水酸基、アルコキシ基、オキソ基、アミノ基、アル キルアミノ基などに置換されたものを挙げることができ る。式(3)で示される置換基の具体例としては、環状 のものとしては、テトラヒドロフラン-2-イル基、2 -メチルテトラヒドロフラン-2-イル基、テトラヒド ロピラン-2-イル基、2-メチルテトラヒドロピラン -2-イル基、直鎖状又は分岐状のものとしては具体的 基、ブトキシエチル基、エトキシプロピル基が好まし W.

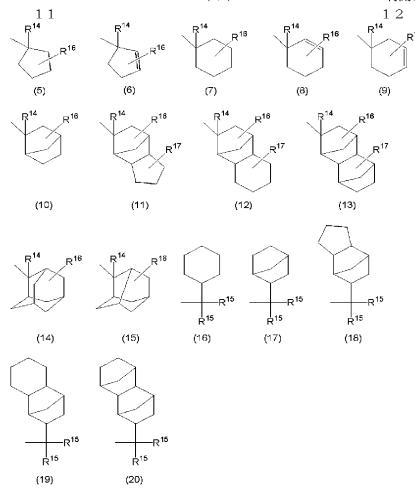
[0018]

【化6】

【0019】式(4)に示される三級アルキル基として は、tert-ブチル基、トリエチルカルビル基、1-エチルノルボルニル基、1-メチルシクロヘキシル基、 1-エチルシクロペンチル基、2-(2-メチル)アダ マンチル基、2-(2-エチル)アダマンチル基、te rt-アミル基、1,1,1,3,3,3-ヘキサフル 30 【化7】 オロー2-メチルーイソプロピル基、1,1,1,3,*

*3,3-ヘキサフルオロ-2-シクロヘキシル-イソプ ロピル基等を挙げることができる他、下記に示す式 (5)~(20)のものを具体的に挙げることができ る。

【0020】



【0021】ここで、R14は炭素数1~6の直鎖状、分 岐状又は環状のアルキル基を示し、具体的にはメチル ル基、sec-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシ ル基、シクロプロピル基、シクロプロピルメチル基、シ クロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等 を例示できる。R15は炭素数2~6の直鎖状、分岐状又 は環状のアルキル基を示し、具体的にはエチル基、プロ ピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、sec-ブチ ル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、シクロプロピ ル基、シクロプロピルメチル基、シクロブチル基、シク ロペンチル基、シクロヘキシル基等を例示できる。

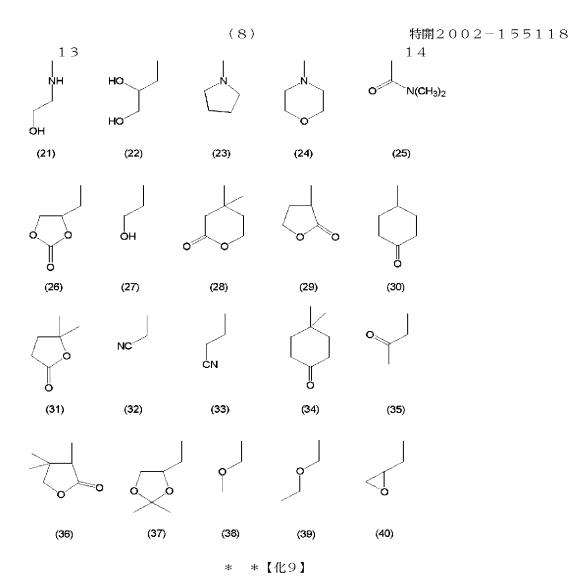
【0022】R¹⁶、R¹⁷は水素原子、炭素数1~6のへ 40 テロ原子を含んでもよい1価炭化水素基、又は炭素数1 ~6のヘテロ原子を介してもよい1価炭化水素基を示 す。ヘテロ原子としては、酸素原子、硫黄原子、窒素原 子を挙げることができ、-OH、-OR(Rはアルキル*

*基、以下同じ)、-O-、-S-、-S(=O)-、-NH2、-NHR、-NR2、-NH-、-NR-として 基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチ 30 含有又は介在することができる。R16、R17としては、 水素原子、アルキル基、ヒドロキシアルキル基、アルコ キシ基、アルコキシアルキル基などを挙げることがで き、これらは直鎖状、分岐状、環状のいずれでもよい。 具体的には、メチル基、ヒドロキシメチル基、エチル 基、ヒドロキシエチル基、プロピル基、イソプロピル 基、n-ブチル基、sec-ブチル基、n-ペンチル 基、n-ヘキシル基、メトキシ基、メトキシメトキシ 基、エトキシ基、tert-ブトキシ基等を例示でき る。

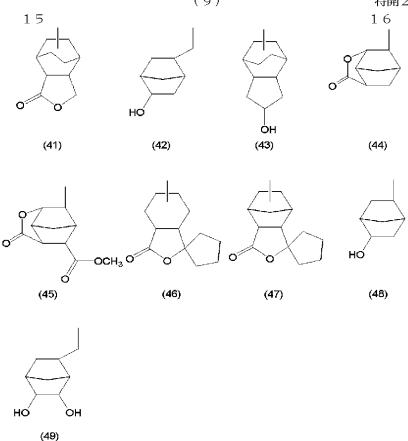
> 【0023】次に、式(1)における密着性基について 説明する。密着性基については種々選定されるが、下記 置換基(21)~(49)が挙げられる。

[0024]

【化8】



[0025]



【0026】この場合、上記式(1)において、R4~R6を含む単位(ユニット)のうち少なくとも一つが脂環式構造を有することが好ましく、特にR5が少なくとも一つの脂環式構造を有することが好ましい。

【0027】上記式(1)において、 $0 < k + m + n \le 1$ であり、好ましくはk + m + n = 1である。k、m、nは好ましくはそれぞれ正数で、kは $0.05 \sim 0.7$ 、より好ましくは $0.1 \sim 0.6$ 、mは $0.1 \sim 0.7$ 、より好ましくは $0.1 \sim 0.5$ 、nは $0.01 \sim 0.5$ であることが好ましい。

【0028】この場合、本発明の高分子化合物は、他の単位を含んでもよく、この単位とk、m、nとの合計を1とすることができる。

【0029】上記高分子化合物の重量平均分子量は1,000~1,000,000、特に2,000~100,000とすることが望ましい。

【0030】本発明の高分子化合物を合成する場合、上記式(1)の各単位を与えるモノマー類と溶媒を混合し、触媒を添加して、場合によっては加熱又は冷却しながら重合反応を行う。重合反応は開始剤(又は触媒)の種類、開始の方法(光、熱、放射線、プラズマなど)、重合条件(温度、圧力、濃度、溶媒、添加物)などによっても支配される。本発明の高分子化合物の重合においては、AIBNなどのラジカルによって重合が開始されるラジカル重合、アルキルリチウムなどの触媒を用いたイオン重合(アニオン重合)などが一般的である。

*【0031】ラジカル重合開始剤としては特に限定され るものではないが、例として2,2'-アゾビス(4-メトキシー2,4-ジメチルバレロニトリル)、2, 2'-アゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)、 2, 2-アゾビスイソブチロニトリル、2, 2'-アゾ 30 ビス(2,4,4-トリメチルペンタン)などのアゾ系 化合物、セーブチルパーオキシピバレート、ラウロイル パーオキサイド、ベンゾイルパーオキサイド、t-ブチ ルパーオキシラウレートなどの過酸化物系化合物、また 水溶性開始剤としては過硫酸カリウムのような過硫酸 塩、過酸化水素或いはこれらと亜硫酸水素ナトリウム、 チオ硫酸ナトリウムのような還元剤との組み合わせから なるレドックス、更にはこれらに少量の鉄、第一鉄塩、 硝酸銀等を共存させた系等の無機系開始剤、又はジコハ ク酸パーオキサイド、ジグルタル酸パーオキシド、モノ コハク酸パーオキシドのような二塩基酸化合物、アゾビ スイソブチルアミジン二塩基酸塩等の有機系開始剤が例 示される。重合開始剤の使用量は、種類、重合反応条件 等に応じて適宜変更可能であるが、通常は重合させるべ き単量体全量に対して0.001~5重量%、特に0. 01~1重量%が採用される。

【0032】また、重合反応においては、重合溶媒を用いてもよい。重合溶媒としては、重合反応を阻害しないものが好ましく、代表的なものとしては、酢酸エチル、酢酸nーブチルなどのエステル系、アセトン、メチルエ*50 チルケトン、メチルイソブチルケトンなどのケトン系、

トルエン、キシレン、シクロへキサンなどの脂肪族又は 芳香族炭化水素系、イソプロピルアルコール、エチレン グリコールモノメチルエーテルなどのアルコール系、ジ エチルエーテル、ジオキサン、テトラヒドロフランなど のエーテル系溶剤が使用できる。これらの溶剤は単独で も或いは2種類以上を混合しても使用できる。

【0033】更には、ドデシルメルカプタンのような公知の分子量調整剤を併用してもよい。重合反応の反応温度は重合開始剤の種類或いは溶媒の沸点により適宜変更され、通常は20~200℃が好ましく、特に50~1 1040℃が好ましい。かかる重合反応に用いる反応容器は特に限定されない。

【0034】このようにして得られる本発明にかかる重合体の溶液又は分散液から、媒質である有機溶媒又は水を除去する方法としては、公知の方法のいずれも利用できるが、例を挙げれば再沈澱沪過又は減圧下での加熱留出等の方法がある。

【 0 0 3 5 】本発明の高分子化合物は、レジスト材料、 特に化学増幅型、とりわけ化学増幅ボジ型レジスト材料 のベース樹脂として使用することができる。

【0036】なお、本発明の高分子化合物においては、膜の力学物性、熱的物性、アルカリ可溶性、その他の物性を変える目的で他の高分子化合物を混合することができる。その際、混合できる高分子化合物の範囲は特に限定されないが、レジスト用の公知の高分子化合物等と任意の範囲で混合することができる。

【0037】本発明のレジスト材料は、本発明の高分子 化合物をベース樹脂とする以外は、公知の成分を用いて 調製し得るが、特に化学増幅ポジ型レジスト材料は、

(A)上記高分子化合物(ベース樹脂)、(B)有機溶 30 剤、(C)酸発生剤を含有する。この場合、これらレジスト材料に、更に(D)塩基性化合物、(E)溶解阻止剤を配合してもよい。

【0038】ここで、本発明で使用される(B)成分の 有機溶剤としては、ベース樹脂、酸発生剤、その他の添 加剤等が溶解可能な有機溶剤であればいずれでもよい。 このような有機溶剤としては、例えばシクロヘキサノ ン、メチルー2-n-アミルケトン等のケトン類、3-メトキシブタノール、3-メチル-3-メトキシブタノ ール、1-メトキシ-2-プロパノール、1-エトキシ -2-プロパノール等のアルコール類、プロピレングリ コールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノメ チルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテ ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレ ングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコール ジメチルエーテル等のエーテル類、プロピレングリコー ルモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコー ルモノエチルエーテルアセテート、乳酸エチル、ピルビ ン酸エチル、酢酸ブチル、3-メトキシプロピオン酸メ チル、3-エトキシプロピオン酸エチル、酢酸tert 50 オニック)酸メチルエステル、2H-パーフルオロ-5

ーブチル、プロピオン酸tertーブチル、プロピレン グリコールモノtertーブチルエーテルアセテート等 のエステル類、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香 族類が挙げられる。

1.8

【0039】また、フッ素化された有機溶媒も用いるこ とができる。具体的に例示すると、2-フルオロアニソ ール、3-フルオロアニソール、4-フルオロアニソー ル、2、3-ジフルオロアニソール、2、4-ジフルオ ロアニソール、2,5-ジフルオロアニソール、5,8 ージフルオロー1,4ーベンゾジオキサン、2,3ージ フルオロベンジルアルコール、1,3-ジフルオロー2 ープロパノール、1,1,1,3,3,3ーヘキサフル オロイソプロピルアルコール、2',4'ージフルオロ プロピオフェノン、2,4-ジフルオロトルエン、トリ フルオロアセトアルデヒドエチルヘミアセタール、トリ フルオロアセトアミド、トリフルオロエタノール、2, 2,2-トリフルオロエチルブチレート、エチルヘプタ フルオロブチレート、エチルヘプタフルオロブチルアセ テート、エチルヘキサフルオログルタリルメチル、エチ $20 \quad \nu - 3 - \nu = 100$ ート、エチルー2-メチルー4,4,4-トリフルオロ アセトアセテート、エチルペンタフルオロベンゾエー ト、エチルペンタフルオロプロピオネート、エチルペン タフルオロプロピニルアセテート、エチルパーフルオロ オクタノエート、エチルー4,4,4ートリフルオロア セトアセテート、エチルー4,4,4ートリフルオロブ チレート、エチルー4,4,4ートリフルオロクロトネ ート、エチルトリフルオロスルホネート、エチルー3-(トリフルオロメチル) ブチレート、エチルトリフルオ ロピルベート、S-エチルトリフルオロアセテート、フ ルオロシクロヘキサン、2,2,3,3,4,4,4-ヘプタフルオロー1ーブタノール、1,1,1,2, 2,3,3-ヘプタフルオロ-7,7-ジメチル-4, 6-オクタンジオン、1,1,1,3,5,5,5-ヘ プタフルオロペンタン-2,4-ジオン、3,3,4, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5-ヘプタフルオロー2-ペ ンタノン、イソプロピルー4,4,4ートリフルオロア セトアセテート、メチルパーフルオロデナノエート、メ チルパーフルオロ(2-メチル-3-オキサヘキサノエ ート)、メチルパーフルオロノナノエート、メチルパー フルオロオクタノエート、メチルー2,3,3,3ーテ トラフルオロプロピオネート、メチルトリフルオロアセ トアセテート、メチルトリフルオロアセトアセテート、 1, 1, 1, 2, 2, 6, 6, 6-オクタフルオロー 2, 4-ヘキサンジオン、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロ-1-ペンタノール、<math>1H, 1H, 2H, 2H-パーフルオロー1-デカノール、パー フルオロ(2,5-ジメチル-3,6-ジオキサンアニ

-メチル-3, 6-ジオキサノナン、1H, 1H, 2H, 3H, 3H-パーフルオロノナン-1, 2-ジオー ル、1H, 1H, 9H-パーフルオロー1-ノナノー ル、1日、1日-パーフルオロオクタノール、1日、1 H, 2H, 2H-パーフルオロオクタノール、2H-パ ーフルオロー5、8、11、14ーテトラメチルー3、 6,9,12,15-ペンタオキサオクタデカン、パー フルオロトリブチルアミン、パーフルオロトリヘキシル アミン、パーフルオロー2,5,8-トリメチルー3, 6,9-トリオキサドデカン酸メチルエステル、パーフ 10 ジエチレングリコールジメチルエーテルや1-エトキシ ルオロトリペンチルアミン、パーフルオロトリプロピル アミン、1H, 1H, 2H, 3H, 3H-パーフルオロ ウンデカン-1,2-ジオール、トルフルオロブタノー ル1,1,1-トリフルオロー5-メチルー2,4-ヘ キサンジオン、1,1,1-トリフルオロー2-プロパ ノール、3,3,3ートリフルオロー1ープロパノー ル、1、1、1-トリフルオロ-2-プロピルアセテー ト、パーフルオロブチルテトラヒドロフラン、パーフル オロ (ブチルテトラヒドロフラン)、パーフルオロデカ リン、パーフルオロ(1,2-ジメチルシクロヘキサ ン)、パーフルオロ(1,3-ジメチルシクロヘキサ ン)、プロピレングリコールトリフルオロメチルエーテ ルアセテート、プロピレングリコールメチルエーテルト リフルオロメチルアセテート、トリフルオロメチル酢酸* $(R^{18})_n M^+ K^-$

(但し、式中R18はそれぞれ炭素数1~12の直鎖状、 分岐状又は環状のアルキル基、炭素数6~20のアリー ル基、又は炭素数7~12のアラルキル基を示し、M+ はヨードニウム、スルホニウムを表し、K-は非求核性 対向イオンを表し、nは2又は3である。)

【0044】R18のアルキル基としては、メチル基、エ チル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、2-オキ ソシクロペンチル基、ノルボルニル基、アダマンチル基 等が挙げられる。アリール基としては、フェニル基、p ーメトキシフェニル基、m-メトキシフェニル基、o-メトキシフェニル基、エトキシフェニル基、p-ter tーブトキシフェニル基、m-tertーブトキシフェ ニル基等のアルコキシフェニル基、2-メチルフェニル 基、3-メチルフェニル基、4-メチルフェニル基、エ チルフェニル基、4-tert-ブチルフェニル基、4※40

(但し、R19、R20は炭素数1~12の直鎖状、分岐状 又は環状のアルキル基又はハロゲン化アルキル基、炭素 数6~12のアリール基又はハロゲン化アリール基又は 炭素数7~12のアラルキル基を示す。)

【0046】R¹⁹、R²⁰のアルキル基としてはメチル 基、エチル基、プロピル基、ブチル基、アミル基、シク ロペンチル基、シクロヘキシル基、ノルボルニル基、ア★50 基、p-tert-ブトキシフェニル基、m-tert

*ブチル、3-トリフルオロメトキシプロピオン酸メチ ル、パーフルオロシクロヘキサノン、プロピレングリコ ールトリフルオロメチルエーテル、トリフルオロ酢酸ブ チル、1,1,1-トリフルオロー5,5-ジメチルー 2,4-ヘキサンジオンなどが挙げられる。

20

【0040】これらの溶媒は1種を単独で又は2種以上 を混合して使用することもできるが、これらに限定され るものではない。本発明では、これらの有機溶剤の中で もレジスト成分中の酸発生剤の溶解性が最も優れている -2-プロパノールの他、安全溶剤であるプロピレング リコールモノメチルエーテルアセテート及びその混合溶 剤が好ましく使用される。

【0041】なお、有機溶剤の使用量は、適宜選定され 得るが、通常、全ベース樹脂100重量部に対し300 ~10,000重量部、特に400~5,000重量部 とすることができる。

【OO42】(C)成分の酸発生剤としては、下記一般 式(50)のオニウム塩、式(51)のジアゾメタン誘 20 導体、式 (52) のグリオキシム誘導体、β-ケトスル ホン酸誘導体、ジスルホン誘導体、ニトロベンジルスル ホネート誘導体、スルホン酸エステル誘導体、イミドイ ルスルホネート誘導体等が挙げられる。

【0043】

(50)

※-ブチルフェニル基、ジメチルフェニル基等のアルキル フェニル基等が挙げられる。アラルキル基としてはベン ジル基、フェネチル基等が挙げられる。K-の非求核性 対向イオンとしては塩化物イオン、臭化物イオン等のハ 30 ライドイオン、トリフレート、1,1,1ートリフルオ ロエタンスルホネート、ノナフルオロブタンスルホネー ト等のフルオロアルキルスルホネート、トシレート、ベ ンゼンスルホネート、4-フルオロベンゼンスルホネー ト、1,2,3,4,5-ペンタフルオロベンゼンスル ホネート等のアリールスルホネート、メシレート、ブタ ンスルホネート等のアルキルスルホネートが挙げられ

[0045] 【化10】

(51)

★ダマンチル基等が挙げられる。ハロゲン化アルキル基と してはトリフルオロメチル基、1,1,1-トリフルオ ロエチル基、1,1,1-トリクロロエチル基、ノナフ ルオロブチル基等が挙げられる。アリール基としてはフ ェニル基、pーメトキシフェニル基、mーメトキシフェ ニル基、oーメトキシフェニル基、エトキシフェニル

ーブトキシフェニル基等のアルコキシフェニル基、2-メチルフェニル基、3-メチルフェニル基、4-メチル フェニル基、エチルフェニル基、4-tert-ブチル フェニル基、4-ブチルフェニル基、ジメチルフェニル 基等のアルキルフェニル基が挙げられる。ハロゲン化ア リール基としてはフルオロフェニル基、クロロフェニル* *基、1,2,3,4,5-ペンタフルオロフェニル基等 が挙げられる。アラルキル基としてはベンジル基、フェ ネチル基等が挙げられる。

[0047] 【化11】

$$R^{22}$$
 R^{23}
 R^{21} SO_2 O N C C N O SO_2 R^{21} (52)

(但し、式中、 R^{21} 、 R^{22} 、 R^{23} は炭素数 $1\sim 1$ 2の直 10% タンスルホン酸ジシクロヘキシルフェニルスルホニウ 鎖状、分岐状又は環状のアルキル基又はハロゲン化アル キル基、炭素数6~12のアリール基又はハロゲン化ア リール基、又は炭素数7~12のアラルキル基を示す。 R²²、R²³は互いに結合して環状構造を形成してもよ く、環状構造を形成する場合、R22、R23はそれぞれ炭 素数1~6の直鎖状、分岐状のアルキレン基を示す。) 【0048】R²¹、R²²、R²³のアルキル基、ハロゲン 化アルキル基、アリール基、ハロゲン化アリール基、ア ラルキル基としては、R19、R20で説明したものと同様 の基が挙げられる。なお、R²²、R²³のアルキレン基と してはメチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレ ン基、ヘキシレン基等が挙げられる。

【0049】酸発生剤として具体的には、例えばトリフ ルオロメタンスルホン酸ジフェニルヨードニウム。トリ フルオロメタンスルホン酸(p-tert-ブトキシフ ェニル)フェニルヨードニウム、pートルエンスルホン 酸ジフェニルヨードニウム、pートルエンスルホン酸 (p-tert-ブトキシフェニル)フェニルヨードニ ウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリフェニルスル ホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸(p-ter t-ブトキシフェニル) ジフェニルスルホニウム、トリ フルオロメタンスルホン酸ビス(p-tert-ブトキ シフェニル) フェニルスルホニウム、トリフルオロメタ ンスルホン酸トリス(p-tert-ブトキシフェニ ル)スルホニウム、p-トルエンスルホン酸トリフェニ ルスルホニウム、pートルエンスルホン酸(p-ter tーブトキシフェニル)ジフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸ビス(p-tert-ブトキシフェ ニル)フェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸 トリス (p-tert-ブトキシフェニル) スルホニウ ム、ノナフルオロブタンスルホン酸トリフェニルスルホ ニウム、ブタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、 トリフルオロメタンスルホン酸トリメチルスルホニウ ム、pートルエンスルホン酸トリメチルスルホニウム、 トリフルオロメタンスルホン酸シクロヘキシルメチル (2-オキソシクロヘキシル)スルホニウム、p-トル エンスルホン酸シクロヘキシルメチル(2-オキソシク ロヘキシル)スルホニウム、トリフルオロメタンスルホ ン酸ジメチルフェニルスルホニウム、pートルエンスル ホン酸ジメチルフェニルスルホニウム、トリフルオロメ※50 ルグリオキシム、ビスー〇-(n-ブタンスルホニル)

ム、pートルエンスルホン酸ジシクロヘキシルフェニル スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリナフ チルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸シク ロヘキシルメチル(2-オキソシクロヘキシル)スルホ ニウム、トリフルオロメタンスルホン酸(2-ノルボニ ル)メチル(2-オキソシクロヘキシル)スルホニウ ム、エチレンビス「メチル(2-オキソシクロペンチ ル)スルホニウムトリフルオロメタンスルホナート]、 1,2'-ナフチルカルボニルメチルテトラヒドロチオ フェニウムトリフレート等のオニウム塩、ビス(ベンゼ ンスルホニル) ジアゾメタン、ビス(p-トルエンスル ホニル) ジアゾメタン、ビス(キシレンスルホニル) ジ アゾメタン、ビス(シクロヘキシルスルホニル)ジアゾ メタン、ビス(シクロペンチルスルホニル)ジアゾメタ ン、ビス(n-ブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス (イソブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(sec ーブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(n-プロピ ルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (イソプロピルスル ホニル)ジアゾメタン、ビス(tertーブチルスルホ ニル) ジアゾメタン、ビス (n-アミルスルホニル) ジ アゾメタン、ビス (イソアミルスルホニル) ジアゾメタ ン、ビス(sec-アミルスルホニル)ジアゾメタン、 ビス(tert-アミルスルホニル)ジアゾメタン、1 ーシクロヘキシルスルホニルー1ー(tertーブチル スルホニル) ジアゾメタン、1-シクロヘキシルスルホ ニルー1ー(tertーアミルスルホニル)ジアゾメタ ン、1-tert-アミルスルホニル-1-(tert ブチルスルホニル)ジアゾメタン等のジアゾメタン誘 導体、ビス-O-(p-トルエンスルホニル)-α-ジ メチルグリオキシム、ビス-O-(p-トルエンスルホ $(-\alpha)$ $(-\alpha)$ $(-\alpha)$ $(-\alpha)$ $(-\alpha)$ $(-\alpha)$ $(-\alpha)$ **-トルエンスルホニル)-α-ジシクロヘキシルグリオ** キシム、ビス-O-(p-トルエンスルホニル)-2. 3-ペンタンジオングリオキシム、ビス-O-(p-ト ルエンスルホニル)-2-メチル-3,4-ペンタンジ オングリオキシム、ビスー〇一(n-ブタンスルホニ (μ) $-\alpha$ - $\hat{\nu}$ $\hat{\nu}$ $タンスルホニル) - \alpha - ジフェニルグリオキシム、ビス$ -O-(n-ブタンスルホニル)-α-ジシクロヘキシ

-2,3-ペンタンジオングリオキシム、ビスー〇一 (n-ブタンスルホニル)-2-メチル-3,4-ペン タンジオングリオキシム、ビス-O-(メタンスルホニ ルオロメタンスルホニル) - α - ジメチルグリオキシ ム、ビス-O-(1,1,1-トリフルオロエタンスル ホニル) $-\alpha$ -ジメチルグリオキシム、ビス-O-(t ert - ブタンスルホニル) $-\alpha$ - ジメチルグリオキシ ム、ビス-〇-(パーフルオロオクタンスルホニル)-ンスルホニル) $-\alpha$ - \overline{y} \overline{y} \overline{y} \overline{y} \overline{z} \overline{z} \overline{z} \overline{z} (ベンゼンスルホニル) - α - ジメチルグリオキシ ム、ビス-O-(p-フルオロベンゼンスルホニル)- α - ジメチルグリオキシム、ビス-O-(p - t e r t-ブチルベンゼンスルホニル)-α-ジメチルグリオキ シム、ビス $-O-(キシレンスルホニル)-\alpha-ジメチ$ ルグリオキシム、ビス-O-(カンファースルホニル) $-\alpha$ -ジメチルグリオキシム等のグリオキシム誘導体、 2-シクロヘキシルカルボニル-2-(p-トルエンス ルホニル)プロパン、2-イソプロピルカルボニルー2 20 -(p-h)ルエンスルホニル)プロパン等の β -ケトス ルホン誘導体、ジフェニルジスルホン、ジシクロヘキシ ルジスルホン等のジスルホン誘導体、pートルエンスル ホン酸2.6-ジニトロベンジル、p-トルエンスルホ ン酸2、4-ジニトロベンジル等のニトロベンジルスル ホネート誘導体、1,2,3-トリス(メタンスルホニ ルオキシ)ベンゼン、1,2,3-トリス(トリフルオ ロメタンスルホニルオキシ)ベンゼン、1,2,3-ト リス (p-トルエンスルホニルオキシ) ベンゼン等のス ルホン酸エステル誘導体、フタルイミドーイルートリフ レート、フタルイミドーイルートシレート、5ーノルボ ルネン-2,3-ジカルボキシイミド-イルートリフレ ート、5-ノルボルネン-2,3-ジカルボキシイミド ーイルートシレート、5ーノルボルネンー2,3ージカ ルボキシイミドーイルーnーブチルスルホネート等のイ ミドーイルスルホネート誘導体などが挙げられるが、ト リフルオロメタンスルホン酸トリフェニルスルホニウ ム、トリフルオロメタンスルホン酸(p-tert-ブ トキシフェニル)ジフェニルスルホニウム、トリフルオ ロメタンスルホン酸トリス(p‐tert‐ブトキシフ ェニル)スルホニウム、p-トルエンスルホン酸トリフ ェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸(p-t ertーブトキシフェニル) ジフェニルスルホニウム、 p-トルエンスルホン酸トリス (p-tert-ブトキ シフェニル) スルホニウム、トリフルオロメタンスルホ ン酸トリナフチルスルホニウム、トリフルオロメタンス ルホン酸シクロヘキシルメチル(2-オキソシクロヘキ シル)スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸 (2-ノルボニル)メチル(2-オキソシクロヘキシ

ルテトラヒドロチオフェニウムトリフレート等のオニウ ム塩、ビス(ベンゼンスルホニル)ジアゾメタン、ビス (pートルエンスルホニル)ジアゾメタン、ビス(シク ロヘキシルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(n-ブチ ルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (イソブチルスルホ ニル) ジアゾメタン、ビス(sec-ブチルスルホニ ル)ジアゾメタン、ビス(n-プロピルスルホニル)ジ アゾメタン、ビス(イソプロピルスルホニル)ジアゾメ タン、ビス(tertーブチルスルホニル)ジアゾメタ ン等のジアゾメタン誘導体、ビスー〇一(p-トルエン スルホニル) $-\alpha$ -ジメチルグリオキシム、ビス-O-(n-ブタンスルホニル)-α-ジメチルグリオキシム 等のグリオキシム誘導体が好ましく用いられる。なお、 上記酸発生剤は1種を単独で又は2種以上を組み合わせ て用いることができる。オニウム塩は矩形性向上効果に 優れ、ジアゾメタン誘導体及びグリオキシム誘導体は定 在波低減効果に優れるため、両者を組み合わせることに よりプロファイルの微調整を行うことが可能である。

【0050】酸発生剤の添加量は、ベース樹脂100部(重量部、以下同様)に対して0.2~15部が好ましく、0.2部より少ないと露光時の酸発生量が少なく、感度及び解像性が悪い場合があり、15部より多いと透明性が低くなり解像性が低下する場合がある。

【0051】(D)成分の塩基性化合物は、酸発生剤より発生する酸がレジスト膜中に拡散する際の拡散速度を抑制することができる化合物が適している。このような塩基性化合物の配合により、レジスト膜中での酸の拡散速度が抑制されて解像度が向上し、露光後の感度変化を抑制したり、基板や環境依存性を少なくし、露光余裕度やパターンプロファイル等を向上することができる(特開平5-232706号、同5-249683号、同5-158239号、同5-249662号、同5-257282号、同5-289322号、同5-289340号公報等記載)。

【0052】このような塩基性化合物としては、第一級、第二級、第三級の脂肪族アミン類、混成アミン類、 芳香族アミン類、複素環アミン類、カルボキシ基を有する含窒素化合物、スルホニル基を有する含窒素化合物、水酸基を有する含窒素化合物、ヒドロキシフェニル基を有する含窒素化合物、アルコール性含窒素化合物、アミド誘導体、イミド誘導体等が挙げられる。

ェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸(p-t ert-ブトキシフェニル)ジフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸トリス(p-t ert-ブトキシフェニル)スルホニウム、p-t ert-ブトキシフェニル)スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリナフチルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸シクロヘキシルメチル(2-d オキソシクロヘキシル)スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸 (2-d ルボニウム、トリフルオロメタンスルホン酸 (2-d ルボニウム、1, 2 ーナフチルカルボニルメチ 50 アミン、メチレンジアミン、エチレンジアミン、大トラ

エチレンペンタミン等が例示され、第二級の脂肪族アミ ン類として、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジーn ープロピルアミン、ジイソプロピルアミン、ジーn-ブ チルアミン、ジイソブチルアミン、ジーsec-ブチル アミン、ジペンチルアミン、ジシクロペンチルアミン、 ジヘキシルアミン、ジシクロヘキシルアミン、ジヘプチ ルアミン、ジオクチルアミン、ジノニルアミン、ジデシ ルアミン、ジドデシルアミン、ジセチルアミン、N,N ージメチルメチレンジアミン、N, N-ジメチルエチレ ンジアミン、N, N-ジメチルテトラエチレンペンタミ 10 アミノピリジン、ジメチルアミノピリジン等)、ピリダ ン等が例示され、第三級の脂肪族アミン類として、トリ メチルアミン、トリエチルアミン、トリーnープロピル アミン、トリイソプロピルアミン、トリーnーブチルア ミン、トリイソブチルアミン、トリーsecーブチルア ミン、トリペンチルアミン、トリシクロペンチルアミ ン、トリヘキシルアミン、トリシクロヘキシルアミン、 トリヘプチルアミン、トリオクチルアミン、トリノニル アミン、トリデシルアミン、トリドデシルアミン、トリ セチルアミン、N, N, N', N'-テトラメチルメチ レンジアミン、N, N, N', N'-テトラメチルエチ 20 レンジアミン、N, N, N', N'-テトラメチルテト ラエチレンペンタミン等が例示される。

【0054】また、混成アミン類としては、例えばジメ チルエチルアミン、メチルエチルプロピルアミン、ベン ジルアミン、フェネチルアミン、ベンジルジメチルアミ ン等が例示される。芳香族アミン類及び複素環アミン類 の具体例としては、アニリン誘導体(例えばアニリン、 N-メチルアニリン、N-エチルアニリン、N-プロピ ルアニリン、N, N-ジメチルアニリン、2-メチルア チルアニリン、プロピルアニリン、トリメチルアニリ ン、2-ニトロアニリン、3-ニトロアニリン、4-ニ トロアニリン、2、4ージニトロアニリン、2,6ージ ニトロアニリン、3,5-ジニトロアニリン、N,N-ジメチルトルイジン等)、ジフェニル(p-トリル)ア ミン、メチルジフェニルアミン、トリフェニルアミン、 フェニレンジアミン、ナフチルアミン、ジアミノナフタ レン、ピロール誘導体(例えばピロール、2H-ピロー ル、1-メチルピロール、2、4-ジメチルピロール、 2, 5-ジメチルピロール、<math>N-メチルピロール等)、 オキサゾール誘導体(例えばオキサゾール、イソオキサ ゾール等)、チアゾール誘導体(例えばチアゾール、イ ソチアゾール等)、イミダゾール誘導体(例えばイミダ ゾール、4-メチルイミダゾール、4-メチル-2-フ ェニルイミダゾール等)、ピラゾール誘導体、フラザン 誘導体、ピロリン誘導体(例えばピロリン、2-メチル -1-ピロリン等)、ピロリジン誘導体(例えばピロリ ジン、N-メチルピロリジン、ピロリジノン、N-メチ ルピロリドン等)、イミダゾリン誘導体、イミダゾリジ

26 リジン、エチルピリジン、プロピルピリジン、ブチルピ リジン、4-(1-ブチルペンチル)ピリジン、ジメチ ルピリジン、トリメチルピリジン、トリエチルピリジ ン、フェニルピリジン、3-メチル-2-フェニルピリ ジン、4-tert-ブチルピリジン、ジフェニルピリ ジン、ベンジルピリジン、メトキシピリジン、ブトキシ ピリジン、ジメトキシピリジン、1-メチル-2-ピリ ドン、4-ピロリジノピリジン、1-メチル-4-フェ ニルピリジン、2-(1-エチルプロピル)ピリジン、 ジン誘導体、ピリミジン誘導体、ピラジン誘導体、ピラ ゾリン誘導体、ピラゾリジン誘導体、ピペリジン誘導 体、ピペラジン誘導体、モルホリン誘導体、インドール 誘導体、イソインドール誘導体、1H-インダゾール誘 導体、インドリン誘導体、キノリン誘導体(例えばキノ リン、3-キノリンカルボニトリル等)、イソキノリン 誘導体、シンノリン誘導体、キナゾリン誘導体、キノキ サリン誘導体、フタラジン誘導体、プリン誘導体、プテ リジン誘導体、カルバゾール誘導体、フェナントリジン 誘導体、アクリジン誘導体、フェナジン誘導体、1,1 0-フェナントロリン誘導体、アデニン誘導体、アデノ シン誘導体、グアニン誘導体、グアノシン誘導体、ウラ

シル誘導体、ウリジン誘導体等が例示される。

【0055】更に、カルボキシ基を有する含窒素化合物 としては、例えばアミノ安息香酸、インドールカルボン 酸、アミノ酸誘導体(例えばニコチン酸、アラニン、ア ルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、グリシン、 ヒスチジン、イソロイシン、グリシルロイシン、ロイシ ン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、リジ ニリン、3-メチルアニリン、4-メチルアニリン、エ 30 ン、3-アミノピラジン-2-カルボン酸、メトキシア ラニン等)等が例示され、スルホニル基を有する含窒素 化合物として3ーピリジンスルホン酸、p-トルエンス ルホン酸ピリジニウム等が例示され、水酸基を有する含 窒素化合物、ヒドロキシフェニル基を有する含窒素化合 物、アルコール性含窒素化合物としては、2-ヒドロキ シピリジン、アミノクレゾール、2、4-キノリンジオ ール、3-インドールメタノールヒドレート、モノエタ ノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールア ミン、N-エチルジエタノールアミン、N, N-ジエチ 40 ルエタノールアミン、トリイソプロパノールアミン、 2, 2'ーイミノジエタノール、2ーアミノエタノー ル、3-アミノ-1-プロパノール、4-アミノ-1-ブタノール、4-(2-ヒドロキシエチル)モルホリ ン、2-(2-ヒドロキシエチル)ピリジン、1-(2 ーヒドロキシエチル)ピペラジン、1-[2-(2-ヒ ドロキシエトキシ) エチル] ピペラジン、ピペリジンエ タノール、1-(2-ヒドロキシエチル)ピロリジン、 1-(2-ヒドロキシエチル)-2-ピロリジノン、3 ーピペリジノー1,2ープロパンジオール、3ーピロリ ン誘導体、ピリジン誘導体(例えばピリジン、メチルピ 50 ジノー1,2-プロパンジオール、8-ヒドロキシユロ

リジン、3ークイヌクリジノール、3ートロパノール、 1-メチル-2-ピロリジンエタノール、1-アジリジ ンエタノール、N-(2-ヒドロキシエチル)フタルイ ミド、N-(2-ヒドロキシエチル) イソニコチンアミ ド等が例示される。アミド誘導体としては、ホルムアミ ド、Nーメチルホルムアミド、N, Nージメチルホルム アミド、アセトアミド、N-メチルアセトアミド、N,*

(式中、R²⁴、R²⁵、R²⁶、R³⁰、R³¹はそれぞれ独立 して直鎖状、分岐鎖状又は環状の炭素数 1~20のアル キレン基、R²⁷、R²⁸、R²⁹、R³²、R³³は水素原子、 炭素数1~20のアルキル基又はアミノ基を示し、R27 とR²⁸、R²⁷とR²⁹、R²⁸とR²⁹、R²⁷とR²⁸とR²⁹、 R32とR33はそれぞれ結合して環を形成してもよい。 n、o、pはそれぞれ0~20の整数である。但し、 n、o、p=0のとき、R24、R25、R26、R30、R31 は水素原子を含まない。)

【0058】ここで、R24、R25、R26、R30、R31の アルキレン基としては、炭素数1~20、好ましくは1 ~ 10 、更に好ましくは $1\sim 8$ のものであり、具体的に は、メチレン基、エチレン基、n-プロピレン基、イソ プロピレン基、nーブチレン基、イソブチレン基、nー ペンチレン基、イソペンチレン基、ヘキシレン基、ノニ 30 レン基、デシレン基、シクロペンチレン基、シクロヘキ シレン基等が挙げられる。

【0059】また、R²⁷、R²⁸、R²⁹、R³²、R³³のア ルキル基としては、炭素数1~20、好ましくは1~ 8、更に好ましくは1~6のものであり、これらは直鎖 状、分岐状、環状のいずれであってもよい。具体的に は、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピ ル基、nーブチル基、イソブチル基、tert-ブチル 基、n-ペンチル基、イソペンチル基、ヘキシル基、ノ ニル基、デシル基、ドデシル基、トリデシル基、シクロ 40 ペンチル基、シクロヘキシル基等が挙げられる。更に、 R²⁷ & R²⁸ \ R²⁷ & R²⁹ \ R²⁸ & R²⁸ & R²⁹ \ R²⁷ & R²⁸ & R 29、R32とR33が環を形成する場合、その環の炭素数は $1\sim20$ 、より好ましくは $1\sim8$ 、更に好ましくは $1\sim$ 6であり、またこれらの環は炭素数1~6、特に1~4 のアルキル基が分岐していてもよい。

【0060】n、o、pはそれぞれ0~20の整数であ り、より好ましくは1~10、更に好ましくは1~8の 整数である。

* N - ジメチルアセトアミド、プロピオンアミド、ベンズ アミド等が例示される。イミド誘導体としては、フタル イミド、サクシンイミド、マレイミド等が例示される。 【0056】更に、下記一般式(53)及び(54)で 示される塩基性化合物を配合することもできる。

28

[0057] 【化12】

(53)

(54)

※具体的には、トリス { 2-(メトキシメトキシ) エチ ル} アミン、トリス {2-(メトキシエトキシ) エチ ル} アミン、トリス[2-{(2-メトキシエトキシ) メトキシ} エチル] アミン、トリス{2-(2-メトキ 20 シエトキシ) エチル} アミン、トリス {2-(1-メト キシエトキシ) エチル} アミン、トリス {2-(1-エ トキシエトキシ) エチル} アミン、トリス {2-(1-エトキシプロポキシ) エチル} アミン、トリス[2-{(2-ヒドロキシエトキシ)エトキシ}エチル]アミ ン、4,7,13,16,21,24-ヘキサオキサー 1,10-ジアザビシクロ[8.8.8] ヘキサコサ ン、4, 7, 13, 18-テトラオキサー1, 10-ジ アザビシクロ[8.5.5]エイコサン、1,4,1 0, 13-テトラオキサー7, 16-ジアザビシクロオ クタデカン、1-アザー12-クラウン-4,1-アザ -15-クラウン-5、1-アザ-18-クラウン-6 等が挙げられる。特に第三級アミン、アニリン誘導体、 ピロリジン誘導体、ピリジン誘導体、キノリン誘導体、 アミノ酸誘導体、水酸基を有する含窒素化合物、ヒドロ キシフェニル基を有する含窒素化合物、アルコール性含 窒素化合物、アミド誘導体、イミド誘導体、トリス {2 (メトキシメトキシ) エチル} アミン、トリス {2-(2-メトキシエトキシ)エチル}アミン、トリス[2 - {(2-メトキシエトキシ)メチル}エチル]アミ ン、1-アザー15-クラウン-5等が好ましい。

【0062】なお、上記塩基性化合物は1種を単独で又 は2種類以上を組み合わせて用いることができ、その配 合量は前記ベース樹脂100部に対して0.01~2 部、特に〇.01~1部が好適である。配合量が〇.0 1部未満であると添加剤としての効果が十分に得られな い場合があり、2部を超えると解像度や感度が低下する 場合がある。

【0063】次に、(E)成分の溶解阻止剤としては、 酸の作用によりアルカリ現像液への溶解性が変化する分 【0061】上記式(53)、(54)の化合物として※50 子量3,000以下の化合物、特に2,500以下の低 分子量フェノール或いはカルボン酸誘導体の一部或いは 全部を酸に不安定な置換基で置換した化合物を挙げるこ とができる。酸不安定基としては本発明に挙げられるフ ッ素を含むものであってもよいが、従来のフッ素を含ま ないものでもよい。

【0064】分子量2,500以下のフェノール或いは カルボン酸誘導体としては、4,4'-(1-メチルエ チリデン) ビスフェノール、[1,1'ービフェニルー 4,4'-ジオール]2,2'-メチレンビス[4-メ チルフェノール]、4,4ービス(4'ーヒドロキシフ ェニル) 吉草酸、トリス(4-ヒドロキシフェニル) メ タン、1,1,1ートリス(4'ーヒドロキシフェニ ル) エタン、1, 1, 2-トリス(4'-ヒドロキシフ ェニル) エタン、フェノールフタレイン、チモールフタ レイン、3,3'ジフルオロ[(1,1'ビフェニル) 4,4'-ジオール]、3,3',5,5'-テトラフ ルオロ $[(1, 1' - \forall z = 1) - 4, 4' - \forall x = 1]$ $[\nu]$ 、4,4'-[2,2,2-トリフルオロー1-(トリフルオロメチル) エチリデン] ビスフェノール、 4,4'ーメチレンビス[2-フルオロフェノール]、 2, 2'ーメチレンビス[4-フルオロフェノール]、 4,4' イソプロピリデンビス「2-フルオロフェノー ル]、シクロヘキシリデンビス[2-フルオロフェノー [N]、[4,4] - [(4-7)ルオロフェニル)メチレ ン] ビス[2-フルオロフェノール]、4,4'ーメチ レンビス[2, 6-ジフルオロフェノール], 4, 4'- (4-フルオロフェニル)メチレンビス[2,6-ジ フルオロフェノール]、2,6-ビス[(2-ヒドロキ シー5-フルオロフェニル)メチル]-4-フルオロフ ェノール、2,6ービス[(4ーヒドロキシー3ーフル オロフェニル)メチル]-4-フルオロフェノール、 2、4-ビス[(3-ヒドロキシ-4-ヒドロキシフェ ニル)メチル]-6-メチルフェノール等が挙げられ、 酸に不安定な置換基としては、式(2)~(4)と同様 のものが挙げられる。

【0065】好適に用いられる溶解阻止剤の例としては、3,3',5,5'ーテトラフルオロ[(1,1'] オキシフェニル)エタン、1,1,2ートリス(4'ーエトキシカルボニルル】、4,4'ー[2,2] スートリフルオロー1ー (トリフルオロメチル)エチリデン】ビスフェノールー 40 エトキシ)フェニル)エタン、1,1,2ートリス(4'ー(1'ーエトキシプロピルオキシ)フェニル)メタン、ビス(4ー(2'ーテトラヒドロフラニルオキシ) フェニル)メタン、ビス(4ー(2'ーテトラヒドロフラニルオキシ) エタン、2ートリフルオロメチルベンゼンカルボン酸ー セーブチルエステル、2ートリフルオロメチルシクロへ キサンカルボン酸ーセーブチルエステル、デオキシコール酸 カルボニルメチルオキシフェニル)メタン、ビス(4ーもertーブトキシカルボニルメチルオキシフェニル)メタン、ビス(4ー(1'ーエトキシプロピルオキシ)フェニル)メタン、ビス(4ー(1'ーエトキシプロピルオキシ)フェニル) メタン、ビス(4ー(1'ーエトキシプロピルオキシ)フェニル)メタン、ビス(4ー(1'ーエトキシプロピルオキシ)フェニル)メタン、ビス(4ー(1'ーエトキシプロピルオキシ)フェニル)メタン、ビス(4ー(1'ーエトキシプロピルオキシ)フェニル)メタン、ビス(4ー(1'ーエトキシプロピルオキシ)フェニル)メタン、ビス(4ー(1'ーエトキシプロピルオキシ)フェニル)メタン、ビス(4ー(1'ーエトキシプロピルオキシ)フェニル)メタン、ビス(4ー(1'ーエトキシプロピルオキシ)フェニル)メタン、ビス(4ー(1'ーエトキシアロピルオキシフェニル) メタン、2ービス(4'ー(2'ーデトラカルボン酸テトラーセーブチルエステル) ル、「1,1'ービシクロへキシルー3,3',4,1'ーデトラカルボン酸テトラーセーブチルエステル】

3.0 ドロピラニルオキシ))プロパン、2,2-ビス(4) - (2' 'ーテトラヒドロフラニルオキシ)フェニル) プロパン、2, 2-ビス(4' - tert-ブトキシフ ェニル) プロパン、2, 2-ビス(4'-tert-ブ トキシカルボニルオキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-tert-ブトキシカルボニルメチルオキシ フェニル) プロパン、2,2-ビス(4'-(1')'-エトキシエトキシ)フェニル)プロパン、2,2-ビス (4'-(1''-エトキシプロピルオキシ)フェニ ル)プロパン、4,4-ビス(4'-(2''-テトラ ヒドロピラニルオキシ)フェニル) 吉草酸tertーブ チル、4,4-ビス(4'-(2''-テトラヒドロフ ラニルオキシ)フェニル) 吉草酸 t e r t - ブチル、 4, 4-ビス (4'-tert-ブトキシフェニル) 吉 草酸tertーブチル、4,4ービス(4-tert-ブトキシカルボニルオキシフェニル) 吉草酸tert-ブチル、4,4ービス(4'-tertーブトキシカル ボニルメチルオキシフェニル) 吉草酸tert-ブチ ル、4,4-ビス(4'-(1''-エトキシエトキ 20 シ)フェニル) 吉草酸 tertーブチル、4,4ービス (4'-(1''-エトキシプロピルオキシ)フェニ ル) 吉草酸tert-ブチル、トリス(4-(2'-テ トラヒドロピラニルオキシ)フェニル)メタン、トリス (4-(2)ーテトラヒドロフラニルオキシ)フェニ ル) メタン、トリス(4-tert-ブトキシフェニ ル) メタン、トリス (4-tert-ブトキシカルボニ ルオキシフェニル) メタン、トリス (4-tertーブ トキシカルボニルオキシメチルフェニル) メタン、トリ ス(4-(1'-エトキシエトキシ)フェニル)メタ ン、トリス(4-(1'-エトキシプロピルオキシ)フ ェニル) メタン、1,1,2-トリス(4'-(2'' ーテトラヒドロピラニルオキシ)フェニル)エタン、 1, 1, 2-トリス(4'-(2''-テトラヒドロフ ラニルオキシ)フェニル)エタン、1,1,2-トリス (4'-tert-ブトキシフェニル) エタン、1, 1,2-トリス(4'-tert-ブトキシカルボニル オキシフェニル) エタン、1,1,2-トリス(4'tert-ブトキシカルボニルメチルオキシフェニル) エタン、1,1,2-トリス(4'-(1'-エトキシ 40 エトキシ)フェニル)エタン、1,1,2ートリス (4'-(1'-エトキシプロピルオキシ)フェニル) エタン、2-トリフルオロメチルベンゼンカルボン酸ー t-ブチルエステル、2-トリフルオロメチルシクロへ キサンカルボン酸ーt-ブチルエステル、デカヒドロナ フタレン-2,6-ジカルボン酸-t-ブチルエステ ル、コール酸-t-ブチルエステル、デオキシコール酸 - t - ブチルエステル、アダマンタンカルボン酸- t -ブチルエステル、アダマンタン酢酸-t-ブチルエステ ル、[1, 1'-ビシクロヘキシル-3, 3', 4,

等が挙げられる。

【0066】本発明のレジスト材料中における溶解阻止 剤の添加量としては、レジスト材料中の固形分100部 に対して20部以下、好ましくは15部以下である。2 O部より多いとモノマー成分が増えるためレジスト材料 の耐熱性が低下する。

【0067】本発明のレジスト材料には、上記成分以外 に任意成分として塗布性を向上させるために慣用されて いる界面活性剤を添加することができる。なお、任意成 分の添加量は、本発明の効果を妨げない範囲で通常量と 10 することができる。

【0068】ここで、界面活性剤としては非イオン性の ものが好ましく、パーフルオロアルキルポリオキシエチ レンエタノール、フッ素化アルキルエステル、パーフル オロアルキルアミンオキサイド、パーフルオロアルキル E〇付加物、含フッ素オルガノシロキサン系化合物等が 挙げられる。例えばフロラード「FC-430」、「F C-431」(いずれも住友スリーエム(株)製)、サ ーフロン「S-141」、「S-145」(いずれも旭 硝子(株)製)、ユニダイン「DS-401」、「DS 20 -403」、「DS-451」(いずれもダイキン工業 (株)製)、メガファック「F-8151」(大日本イ ンキ工業(株)製)、「X-70-092」、「X-7 0-093 (いずれも信越化学工業(株)製)等を挙 げることができる。好ましくはフロラード「FC-43 0」(住友スリーエム(株)製)、「X-70-09 3」(信越化学工業(株)製)が挙げられる。

【0069】本発明のレジスト材料を使用してパターン を形成するには、公知のリソグラフィー技術を採用して 行うことができる。例えばシリコンウエハー等の基板上 30 にスピンコーティング等の手法で膜厚が 0.1~1.0 μmとなるように塗布し、これをホットプレート上で6 0~200℃、10秒~10分間、好ましくは80~1 50℃、30秒~5分間プリベークする。次いで目的の パターンを形成するためのマスクを上記のレジスト膜上 にかざし、遠紫外線、エキシマレーザー、X線等の高エ ネルギー線もしくは電子線を露光量1~200mJ/c m^2 程度、好ましくは $10\sim100$ m J/c m^2 程度とな るように照射した後、ホットプレート上で60~150 ℃、10秒~5分間、好ましくは80~130℃、30 秒~3分間ポストエクスポージャベーク(PEB)す る。更に、0.1~5%、好ましくは2~3%のテトラ メチルアンモニウムヒドロキシド (TMAH) 等のアル カリ水溶液の現像液を用い、10秒~3分間、好ましく は30秒~2分間、浸漬(dip)法、パドル (pud dle)法、スプレー(spray)法等の常法により 現像することにより基板上に目的のパターンが形成され る。なお、本発明材料は、特に高エネルギー線の中でも 120~254 n mの遠紫外線又はエキシマレーザー、 特に193nmのArF、157nmのF₂、146n

mOKr₂, 134nmOKrAr, 126nmOAr₂ などのエキシマレーザー、X線及び電子線、とりわけ波 長110~180m # | 大| 1~30m # の高エネル ギー線による微細パターンニングに最適である。また、 上記範囲を上限及び下限から外れる場合は、目的のパタ ーンを得ることができない場合がある。

【0070】

【発明の効果】本発明のレジスト材料は、高エネルギー 線に感応し、200nm以下、特に170nm以下の波 長における感度が優れているうえに、エステル側鎖への フッ素の導入により透明性が著しく向上し、それと同時 に優れた解像性を有することがわかった。従って本発明 のレジスト材料は、これらの特性により、特にF2エキ シマレーザーなどの露光波長での吸収が小さいレジスト 材料となり得るもので、微細でしかも基板に対して垂直 なパターンを容易に形成でき、このため超LSI製造用 の微細パターン形成材料として好適である。

[0071]

【実施例】以下、合成例及び実施例を示して本発明を具 体的に説明するが、本発明は下記実施例に制限されるも のではない。

【0072】「合成例1]メタクリル酸(2,2,2-トリフルオロエチル)、メタクリル酸(2-エチルアダ マンチル)及び下記モノマー1の共重合(0.4/0.4/0.2)

1 Lのフラスコ中にメタクリル酸(2,2,2-トリフ ルオロエチル)を6.2g、メタクリル酸(2-エチル アダマンチル)を9.2g及び下記モノマー1を4.6 g投入し、それらをトルエン300mLに溶解させ、十 分に系中の酸素を除去した後、開始剤LPOを1.36 g仕込み、60℃まで昇温して24時間重合反応を行っ

【0073】得られたポリマーを精製するために、反応 混合物をメタノールに注ぎ、得られた重合体を沈澱させ た。更に得られたポリマーをテトラヒドロフランに溶か し、メタノール10L中に注いでポリマーを沈澱させる 操作を二回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させ た。このようにして得られた15.2gの白色重合体は 光散乱法により重量平均分子量が9,100であり、G 40 PC溶出曲線より分散度(=Mw/Mn)が1.5の重 合体であることが確認できた。また、1H-NMRの測 定により、ポリマー中のメタクリル酸(2,2,2ート リフルオロエチル)、メタクリル酸(2-エチルアダマ ンチル)、モノマー1の含有比が0.40:0.33: 27であることがわかった。

[0074]

【化13】

Monomer 1

【0075】[合成例2]メタクリル酸(1,1,1,1, 3,3,3-ヘキサフルオロイソプロピル)、メタクリ ル酸(2-エチルアダマンチル)及びモノマー1の共重 10 合(0.4/0.3/0.3)

1 Lのフラスコ中にメタクリル酸(1,1,1,3, 3,3-ヘキサフルオロイソプロピル)を8.3g、メ タクリル酸(2-エチルアダマンチル)を8.7g及び モノマー1を3.0g投入し、それらをトルエン300 mLに溶解させ、十分に系中の酸素を除去した後、開始 剤LPOを1.4g仕込み、60℃まで昇温して24時 間重合反応を行った。

【0076】得られたポリマーを精製するために、反応 混合物をメタノールに注ぎ、得られた重合体を沈澱させ 20 た。更に得られたポリマーをテトラヒドロフランに溶か し、メタノール10L中に注いでポリマーを沈澱させる 操作を二回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させ た。このようにして得られた13.2gの白色重合体は 光散乱法により重量平均分子量が13,000であり、 GPC溶出曲線より分散度 (=Mw/Mn)が1.4の 重合体であることが確認できた。また、1H-NMRの 測定により、ポリマー中のメタクリル酸(1,1,1, 3,3,3-ヘキサフルオロイソプロピル)、メタクリ ル酸(2-エチルアダマンチル)、モノマー1の含有比 30 が0.41:0.20:0.39であることがわかっ た。

【0077】[合成例3] メタクリル酸(2,2,2-トリフルオロエチル)、メタクリル酸(1-エチルシク ロペンチル)及びモノマー1の共重合(0.4/0.4 /0.2)

1Lのフラスコ中にメタクリル酸(2,2,2-トリフ ルオロエチル)を7.7g、メタクリル酸(1-エチル シクロペンチル)を8.4g及びモノマー1を3.9g 投入し、それらをトルエン300mLに溶解させ、十分 40 に系中の酸素を除去した後、開始剤LPOを1.8g仕 込み、60℃まで昇温して24時間重合反応を行った。

【0078】得られたポリマーを精製するために、反応 混合物をメタノールに注ぎ、得られた重合体を沈澱させ た。更に得られたポリマーをテトラヒドロフランに溶か し、メタノール10L中に注いでポリマーを沈澱させる 操作を二回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させ た。このようにして得られた13.9gの白色重合体は 光散乱法により重量平均分子量が11,000であり、 GPC溶出曲線より分散度 (=Mw/Mn) が1.5の 50 合体であることが確認できた。また、 ^1H-NMR の測

重合体であることが確認できた。また、¹H−NMRの 測定により、ポリマー中のメタクリル酸(2,2,2-トリフルオロエチル)、メタクリル酸(1-エチルシク ロペンチル)、モノマー1の含有比が0.41:0.3 5:0.24であることがわかった。

34

【0079】[合成例4]メタクリル酸(1,1,1,1, 3,3,3-ヘキサフルオロイソプロピル)、メタクリ ル酸(1-エチルシクロペンチル)及びモノマー1の共 重合(0.4/0.3/0.3)

1Lのフラスコ中にメタクリル酸(1,1,1,3, 3,3-ヘキサフルオロイソプロピル)を9.5g、メ タクリル酸(1-エチルシクロペンチル)を5.5g及 びモノマー1を5.0g投入し、それらをトルエン30 OmLに溶解させ、十分に系中の酸素を除去した後、開 始剤LPOを1.6g仕込み、60℃まで昇温して24 時間重合反応を行った。

【0080】得られたポリマーを精製するために、反応 混合物をメタノールに注ぎ、得られた重合体を沈澱させ た。更に得られたポリマーをテトラヒドロフランに溶か し、メタノール10L中に注いでポリマーを沈澱させる 操作を二回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させ た。このようにして得られた14.2gの白色重合体は 光散乱法により重量平均分子量が12,000であり、 GPC溶出曲線より分散度 (=Mw/Mn) が1.5の 重合体であることが確認できた。また、1 H-NMRの 測定により、ポリマー中のメタクリル酸(1,1,1, 3,3,3-ヘキサフルオロイソプロピル)、メタクリ ル酸(1-エチルシクロペンチル)、モノマー1の含有 比が0.40:0.25:0.35であることがわかっ た。

【0081】[合成例5]α-トリフルオロメチルアク リル酸(2,2,2-トリフルオロエチル)、メタクリ ル酸(2-エチルアダマンチル)及びモノマー1の共重 合(0.4/0.4/0.2)

1Lのフラスコ中にαートリフルオロメチルアクリル酸 (2, 2, 2-トリフルオロエチル)を16.0g、メ タクリル酸(2-エチルアダマンチル)を12.7g及 びモノマー1を3.1g投入し、それらをトルエン30 OmLに溶解させ、十分に系中の酸素を除去した後、開 始剤LPOを1.07g仕込み、60℃まで昇温して2 4時間重合反応を行った。

【0082】得られたポリマーを精製するために、反応 混合物をメタノールに注ぎ、得られた重合体を沈澱させ た。更に得られたポリマーをテトラヒドロフランに溶か し、メタノール10L中に注いでポリマーを沈殿させる 操作を二回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させ た。このようにして得られた14.2gの白色重合体は 光散乱法により重量平均分子量が9,500であり、G PC溶出曲線より分散度 (=Mw/Mn)が1.5の重

定により、ポリマー中の α ートリフルオロメチルアクリル酸(2, 2, 2ートリフルオロエチル)、メタクリル酸(2-エチルアダマンチル)、モノマー1の含有比が0. 37:0. 38:0. 25であることがわかった。【0083】[合成例6] メタクリル酸(2, 2, 2-トリフルオロエチル)、メタクリル酸(2-エチルアダマンチル)及びメタクリル酸(2-ヒドロキシエチル)の共重合(0. 4/0. 4/0. 2)

1 Lのフラスコ中にメタクリル酸(2,2,2-トリフルオロエチル)を7.0g、メタクリル酸(2-エチル 10 アダマンチル)を10.3g及びメタクリル酸(2-ヒドロキシエチル)を2.7g投入し、それらをトルエン300mLに溶解させ、十分に系中の酸素を除去した後、開始剤LPOを1.24g仕込み、60℃まで昇温して24時間重合反応を行った。

【0084】得られたポリマーを精製するために、反応混合物をメタノールに注ぎ、得られた重合体を沈澱させた。更に得られたポリマーをテトラヒドロフランに溶かし、メタノール10L中に注いでポリマーを沈殿させる操作を二回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。このようにして得られた13.5gの白色重合体は光散乱法により重量平均分子量が10,500であり、GPC溶出曲線より分散度(=Mw/Mn)が1.6の重合体であることが確認できた。また、「H-NMRの測定により、ポリマー中のメタクリル酸(2,2,2ートリフルオロエチル)、メタクリル酸(2ーエチルアダマンチル)、メタクリル酸(2ーヒドロキシエチル)の含有比が0.41:0.38:0.21であることがわかった。

【0085】 [合成例7] メタクリル酸(2,2,2-トリフルオロエチル)、メタクリル酸(2-エチルアダマンチル)及び下記モノマー2の共重合(0.4/0.4/0.2)

1 Lのフラスコ中にメタクリル酸(2,2,2ートリフルオロエチル)を6.4 g、メタクリル酸(2ーエチルアダマンチル)を9.4 g及び下記モノマー2を4.2 g投入し、それらをトルエン300mLに溶解させ、十分に系中の酸素を除去した後、開始剤LPOを1.13 g仕込み、60℃まで昇温して24時間重合反応を行った。

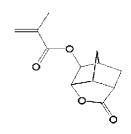
【0086】得られたポリマーを精製するために、反応混合物をメタノールに注ぎ、得られた重合体を沈澱させた。更に得られたポリマーをテトラヒドロフランに溶かし、メタノール10L中に注いでポリマーを沈殿させる操作を二回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。このようにして得られた13.9gの白色重合体は光散乱法により重量平均分子量が9,700であり、GPC溶出曲線より分散度(=Mw/Mn)が1.5の重

合体であることが確認できた。また、 1 H-NMRの測定により、ポリマー中のメタクリル酸(2 , 2 -トリフルオロエチル)、メタクリル酸(2 -エチルアダマンチル)、モノマー 2 の含有比が 0 . 4 5:0.35:0.20であることがわかった。

36

[0087]

【化14】



Monomer 2

【0088】 [比較合成例1] メタクリル酸(2-エチルアダマンチル)及びモノマー1の共重合(0.5/0.5)

1 Lのフラスコ中にメタクリル酸(2-エチルアダマン 20 チル)を12.8g、モノマー1を7.2g投入し、それらをトルエン300mLに溶解させ、十分に系中の酸素を除去した後、開始剤LPOを1.5g仕込み、60 ℃まで昇温して24時間重合反応を行った。

【0089】得られたポリマーを精製するために、反応混合物をメタノールに注ぎ、得られた重合体を沈澱させた。更に得られたポリマーをテトラヒドロフランに溶かし、メタノール10L中に注いでポリマーを沈澱させる操作を二回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。このようにして得られた13.2gの白色重合体は光散乱法により重量平均分子量が11,000であり、GPC溶出曲線より分散度(=Mw/Mn)が1.4の重合体であることが確認できた。また、「H-NMRの測定により、ポリマー中のメタクリル酸(2-エチルアダマンチル)、モノマー1の含有比が0.49:0.51であることがわかった。

【0090】[評価例]

ポリマー透過率測定

得られたポリマー1gをプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート10gに十分に溶解させ、0.2μmのフィルターで沪過して、ポリマー溶液を調製した。ポリマー溶液をMgF₂基板にスピンコーティングし、ホットプレートを用いて100℃で90秒間ベークし、厚さ200nmのポリマー層をMgF₂基板上に作成した。真空紫外光度計(日本分光製、VUV200S)を用いて248nm、193nm、157nmにおける透過率を測定した。測定結果を表1に示す。

[0091]

【表1】

ポリマー	透過率 (%)	透過率 (%)	透過率 (%)
	248nm	193nm	157 n m
合成例1ポリマー	9 2	8 5	3 2
合成例2ポリマー	9 2	8 6	3 5
合成例3ポリマー	9 2	8 4	3 6
合成例4ポリマー	93	8 6	2 5
合成例5ポリマー	9 7	9 2	4 5
合成例6ポリマー	93	8 8	3 9
合成例7ポリマー	9 1	8 5	3 5
比較合成例1ポリマー	8 5	7 5	8

【0092】レジスト調製例

で用いて常法によりレジスト液を調製し、得られたレジ スト液をシリコンウェハーにDUV-30(Brewe rScience社製)を80nmの膜厚で製膜した基 板上にスピンコーティングし、ホットプレートを用いて 100℃で90秒間ベークし、レジストの厚みを200 nmの厚さにした。これをF2エキシマレーザー(VU VES-4500 リソテックジャパン社製)で露光量*

*を変化させながら露光し、露光後直ちに120℃で90 次に、上記ポリマー及び下記に示す成分を表2に示す量 10 秒間ベークし、2.38%のテトラメチルアンモニウム ヒドロキシドの水溶液で60秒間現像を行って、膜厚を 測定し、残膜特性から膜厚がOになる感度(Eth)、 γ値を求めた。実施例4と比較例1の感度曲線の比較を 図1と図2に示す。

[0093]

【化15】

PAG1

PAG2

[0094]

※ ※【表2】

40

					± U		
	ポリマー (重量部)	酸発生剤 (重量部)	塩基性 化合物 (重量部)	溶解 阻止剤 (重量部)	溶剤 (重量部)	感度 (mJ/ cm²)	γ値
実施例 1	合成例 1 (100)	PAG1 (2)	トリフ チルアミン (0.1)	-	PGMEA (1,000)	18	30
実施例 2	合成例 2 (100)	PAG1 (2)	トリフ* チルアミン (0.1)	-	PGMEA (1,000)	18	30
実施例 3	合成例 3 (100)	PAG1 (2)	トリブ*チルアミン (0.1)	-	PGMEA (1,000)	19	25
実施例 4	合成例 4 (100)	PAG1 (2)	トリブ・チルアミン (0.1)	-	PGMEA (1,000)	10	40
実施例 5	合成例 5 (100)	PAG1 (2)	トリフ* <i>チル</i> アミン (0.1)	-	PGMEA (1,000)	15	20
実施例 6	合成例 6 (100)	PAG1 (2)	トリフ* チルアミン (0.1)	ı	PGMEA (1,000)	16	4 2
実施例 7	合成例 7 (100)	PAG1 (2)	トリフ [*] チルアミン (0.1)	-	PGMEA (1,000)	25	33
実施例 8	合成例 1 (100)	PAG2 (2)	トリブ チルアミン (0.1)	-	PGMEA (1,000)	14	30
実施例 9	合成例 1 (100)	PAG1 (2)	トリフ* チルアミン (0.1)	DRI1 (20)	PGMEA (1,000)	16	32
比較例	比較 合成例 1 (100)	PAG1 (2)	トリフ [*] チルアミン (0. 1)	-	PGMEA (1,000)	20	7

PGMEA: プロピレングリコールモノメチルエーテル アセテート

【0095】表1及び2、図1及び2の結果より、本発明の高分子化合物を用いたレジスト材料は、F2エキシマレーザー(157nm)付近の波長における十分な透明性と、コントラストと感度を満たしていることがわか*

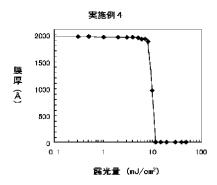
*った。

30 【図面の簡単な説明】

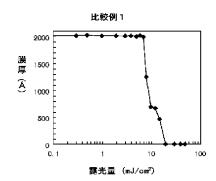
【図1】実施例4ののレジスト材料の露光量と膜厚との関係を示すグラフである。

【図2】比較例1のレジスト材料の露光量と膜厚との関係を示すグラフである。

【図1】



【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 原田 裕次

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社新機能材料技術研究 所内

(72)発明者 渡辺 淳

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社新機能材料技術研究 所内

(72) 発明者 畠山 潤

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社新機能材料技術研究 所内

(72)発明者 河合 義夫

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社新機能材料技術研究 所内

(72)発明者 笹子 勝 大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 遠藤 政孝 大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 岸村 眞治 大阪府門真市大字門真1006番地 (72)発明者 大谷 充孝

埼玉県川越市今福中台2805番地 セントラ ル硝子株式会社化学研究所内

(72)発明者 宮澤 覚

埼玉県川越市今福中台2805番地 セントラ ル硝子株式会社化学研究所内

(72)発明者 堤 憲太郎

埼玉県川越市今福中台2805番地 セントラ ル硝子株式会社化学研究所内

(72)発明者 前田 一彦

東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1 セントラル硝子株式会社内

Fターム(参考) 2H025 AA01 AA02 AB16 AC05 AD03 BE00 BG00 EA10 FA01 FA03 FA12 FA17

4J100 AL08P AL08Q AL08R BA03R

BA11R BA20R BA31R BA40R BB17P BC02Q BC03Q BC04Q BC07Q BC07R BC08Q BC09Q BC12Q BC22Q BC23Q BC26R BC52R BC60R BC65R BC79R

CA05 JA38